

(19)



JAPANESE PATENT OFFICE

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 07225149 A

(43) Date of publication of application: 22 . 08 . 95

(51) Int. Cl

G01J 1/00

G01B 11/02

G01M 11/00

G03B 15/05

(21) Application number: 06255330

(22) Date of filing: 20 . 10 . 94

(30) Priority: 14 . 12 . 93 JP 05313824

(71) Applicant: FUJI PHOTO FILM CO LTD

(72) Inventor: ICHIKAWA FUSAO
MORI AKIRA
OTA HIROYUKI

(54) STROBO UNIT INSPECTION DEVICE, STROBO
UNIT INSPECTION SYSTEM, AND MAIN
CAPACITOR CHARGING METHOD

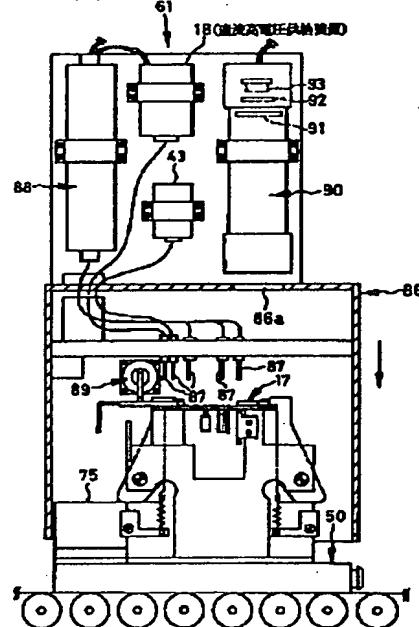
inspection pallet 50.

COPYRIGHT: (C)1995,JPO

(57) Abstract:

PURPOSE: To efficiently perform inspection for using a strobo unit again.

CONSTITUTION: An electrical inspection device 61 moves a light-screening cover 86 to an access position closer to a pallet 50 when the pallet 50 stops at an inspection position. Based on the move of the light-screening cover 86, a probe for switching, a probe for measurement, and a probe 87 for feeding electricity contact each connection terminal of a charging switch, a main capacitor, a synchro switch, and a power battery and an actuator 89 and a photo sensor 93 are positioned near each of the synchro switch and a strobe light emission part. A control part 88 charges a main capacitor, causes a strobo emission part to emit light by the activation of the actuator 89, at the same time checks to see if the amount of light from the strobo emission part reaches a prescribed level, transmits the measurement data and the criterion data to a computer, and at the same time stores the data at an ID unit 75 of the



■(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-225149

(43)公開日 平成7年(1995)8月22日

(51)Int.Cl. ⁶	識別記号	序内整理番号	F I	技術表示箇所
G 0 1 J 1/00	F	8803-2G		
G 0 1 B 11/02				
G 0 1 M 11/00	T	9309-2G		
G 0 3 B 15/05				

審査請求 未請求 請求項の数5 O.L (全17頁)

(21)出願番号 特願平6-255330

(22)出願日 平成6年(1994)10月20日

(31)優先権主張番号 特願平5-313824

(32)優先日 平5(1993)12月14日

(33)優先権主張国 日本 (JP)

(71)出願人 000005201

富士写真フィルム株式会社

神奈川県南足柄市中沼210番地

(72)発明者 市川 房雄

神奈川県南足柄市中沼210番地 富士写真

フィルム株式会社内

(72)発明者 森 亮

神奈川県南足柄市中沼210番地 富士写真

フィルム株式会社内

(72)発明者 太田 博之

神奈川県南足柄市中沼210番地 富士写真

フィルム株式会社内

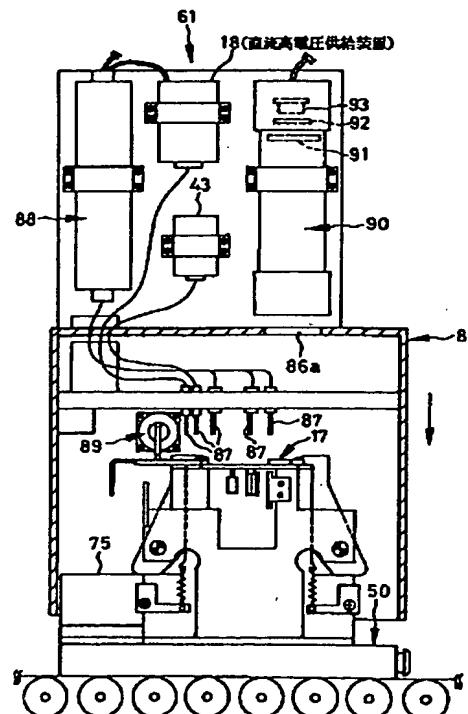
(74)代理人 弁理士 小林 和憲

(54)【発明の名称】ストロボユニットの検査装置及びストロボユニットの検査システム並びにメインコンデンサの充電方法

(57)【要約】 (修正有)

【目的】ストロボユニットの再使用のための検査を効率良く行う。

【構成】電気検査装置61は、パレット50が検査位置に停止すると遮光カバー86をパレット50に近寄った接近位置に移動させる。遮光カバー86の移動によりスイッチング用プローブ、測定用プローブ、及び給電用プローブ87は充電スイッチ、メインコンデンサ、シンクロスイッチ、及び電源電池の接続端子にそれぞれ接触し、また、アクチュエータ89及び光センサ93はシンクロスイッチ及びストロボ発光部の各々の近傍に位置決めされる。制御部88は、メインコンデンサに充電を行い、アクチュエータ89の作動によりストロボ発光部を発光させるとともに、ストロボ発光部からの光量が規定レベルに達しているか否かを判定し、この測定データ及び判定データをコンピュータに伝送すると同時に検査パレット50のIDユニットに記憶させる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 充電スイッチ、メインコンデンサ、電源電池の接続端子、シンクロスイッチ、ストロボ発光部が外部に露呈し、充電スイッチのオンにより前記接続端子からの給電が行われメインコンデンサの充電完了後、シンクロスイッチをオンさせることによりストロボ発光が行われるストロボユニットの検査装置において、前記ストロボユニットを一定の姿勢で保持し、検査位置に移動してきたときに停止されるパレットと、検査位置で停止したパレットが保持するストロボユニットに近寄った接近位置と離れた退避位置との間で可動なベース部と、このベース部に保持され、ベース部が接近位置に移動することによって前記充電スイッチ、メインコンデンサ、シンクロスイッチ、及び電源電池の接続端子にそれぞれ接触するスイッチング用プローブ、測定用プローブ、及び給電用プローブと、前記ベース部に組み込まれ、ベース部が接近位置に移動することによって前記シンクロスイッチ及びストロボ発光部の各々の近傍に位置決めされるアクチュエータ及び光センサと、前記スイッチング用プローブ、測定用プローブ、及び給電用プローブにより前記メインコンデンサへの充電を行い、前記アクチュエータの作動によりシンクロスイッチをオンさせてストロボ発光部を発光させるとともに、前記光センサで受光したストロボ発光部からの光量が規定レベルに達しているか否かを判定する制御手段とからなることを特徴とするストロボユニットの検査装置。

【請求項2】 前記メインコンデンサの充電と同時に電圧、電流、及び抵抗の測定を行い、前記光量レベルの他に充電時間、シンクロスイッチの接触抵抗、リーク電流等を検査することを特徴とする請求項1記載のストロボユニットの検査装置。

【請求項3】 前記メインコンデンサの充電が完了した際に点灯、又は点滅するネオン管の発光検査を行うことを特徴する請求項2記載のストロボユニットの検査装置。

【請求項4】 電気部品及び発光部からなるストロボユニットを一定の姿勢で保持し、所定の検査ラインを循環移動する検査パレットと、この検査パレットに設けられ、各種データの記憶機能及び通信機能を有する情報管理手段と、前記検査ラインに配置され、ストロボユニットを構成する電気部品及び発光部の外観、姿勢、電気特性等を検査し、この検査データを情報管理手段に記憶させる複数の測定装置と、前記検査データに基づいて各ストロボユニットを複数のグループに仕分ける判定制御手段とからなることを特徴とするストロボユニットの検査システム。

【請求項5】 ストロボユニットの電気特性を測定する際に行われるメインコンデンサの充電の方法において、前記メインコンデンサの両端子に耐電圧以下の直流高電圧を直接印加し、かつこの電圧印加中にメインコンデン

サの両端子間の電圧を監視することにより、任意に設定した所定電圧で直流高電圧によるメインコンデンサの充電を終了することを特徴とするメインコンデンサの充電方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】 本発明は、ストロボユニットが再使用可能かどうかを検査する検査装置及び検査システム並びにストロボユニットの電気特性を測定する際に行われるメインコンデンサの充電方法に関するものである。

【0002】

【従来の技術】 従来、特公平2-32615号公報等にレンズ付きフィルムユニット（以下、「フィルムユニット」と称す。）が提案されており、これには国際標準規格ISOの1007-1979年で規定された135タイプのパトローネ付き写真フィルムが工場で予め装填されている。また、ストロボユニットを内蔵したフィルムユニットは、パトローネ付き写真フィルムを装填した本体部と、この本体部の前面に被着される前カバーと、本体部の背面に被着される後カバーとから構成され、本体部にはシャッター機構、レンズ、ストロボユニット等が組み込まれている。このようなフィルムユニットは、パトローネ付きフィルムのネガフィルムの全てのコマの撮影が終了すると、そのまま現像所に提出される。現像所では、露光済の写真フィルムを収納したパトローネを取り出し、現行の現像処理システムを使用して現像及び焼付等の処理を行い、ユーザーにはプリント写真とフィルムネガとが返却される。

【0003】 環境保全や産業廃棄物削減のために、工業製品のリサイクルが行われている。フィルムユニットにおいても、使用後に工場で回収されたものについては、分解した後、再使用できるものはそのまま用い、また使用できないものは原材料としての利用が図られている。そして、再使用可能な部品点数をできるだけ増やすための工夫も行われ、例えば特開平5-19419号公報のものでは、カウンター機構とシャッター機構とを露光ユニットとしてまとめ、さらにストロボ装置についても回路要素及び闪光放電管を1枚のプリント基板上に取り付けてストロボユニットとしてまとめておき、これらをユニットごとに再使用できるようにしている。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】 ところで、部品を再使用する場合には、その性能を検査しておくことが不可欠である。しかしながら、上記の露光ユニットやストロボユニットのように、他部品をまとめてユニット化したものは、その検査が非常に煩雑になる。特にストロボユニットの場合には、単なる外観検査の他に、電気特性、例えば回路の動作や闪光放電管の発光が確実なものであるか否かを確認するために10項目以上の検査が必要であり、こうした検査を一個一個人手で行っていたのでは、

検査時間が非常に長くなってしまい、リサイクルコストを低減することができない。また、従来の測定データは検査工程内でストロボユニットが再使用が可能か否かの判定に使用されるだけで、例えば市場におけるストロボユニットの不良発生状況を把握する等のために有効活用されていなかった。また、ストロボユニットの電気特性を測定する際には、メインコンデンサの充放電を数回繰り返すが、この充電に時間がかかるため、全体の検査時間が短縮できないという問題があった。

【0005】本発明の目的は、上述のような背景に鑑みてなされたもので、再使用可能かどうかの検査を効率良く行うストロボユニットの検査装置を提供することにある。また、ストロボユニットの各種測定データ及び判定データを有効活用できるようにしたストロボユニットの検査システムを提供することにある。また、ストロボユニットの電気特性の測定時間を短縮するメインコンデンサの充電方法を提供することにある。

【0006】

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために請求項1記載のストロボユニットの検査装置は、ストロボユニットを一定の姿勢で保持し、検査位置に移動してきたときに停止されるパレットと、検査位置で停止したパレットが保持するストロボユニットに近寄った接近位置と離れた退避位置との間で可動なベース部と、このベース部に保持され、ベース部が接近位置に移動することによって前記充電スイッチ、メインコンデンサ、シンクロスイッチ、及び電源電池の接続端子にそれぞれ接触するスイッチング用プローブ、測定用プローブ、及び給電用プローブと、前記ベース部に組み込まれ、ベース部が接近位置に移動することによって前記シンクロスイッチ及びストロボ発光部の各々の近傍に位置決めされるアクチュエータ及び光センサと、前記スイッチング用プローブ、測定用プローブ、及び給電用プローブにより前記メインコンデンサへの充電を行い、前記アクチュエータの作動によりシンクロスイッチをオンさせてストロボ発光部を発光させるとともに、前記光センサで受光したストロボ発光部からの光量が規定レベルに達しているか否かを判定する制御手段とを備えたものである。

【0007】請求項2記載のストロボユニットの検査装置は、メインコンデンサの充電と同時に電圧、電流、及び抵抗の測定を行い、前記光量レベルの他に充電時間、シンクロスイッチの接触抵抗、リーク電流等を検査するようにしたものである。さらに、請求項3記載のストロボユニットの検査装置は、前記メインコンデンサの充電が完了した際に点灯、又は点滅するネオン管の発光が正常に行えるか否かを判定するようにしたものである。

【0008】請求項4記載のストロボユニットの検査システムは、電気部品及び発光部からなるストロボユニットを一定の姿勢で保持し、所定の検査ラインを循環移動する検査パレットと、この検査パレットに設けられ、各

種データの記憶機能及び通信機能を有する情報管理手段と、検査ラインに配置され、ストロボユニットを構成する電気部品及び発光部の外観、姿勢、電気特性等を検査し、この検査データを情報管理手段に記憶させる複数の測定装置と、前記検査データに基づいて各ストロボユニットを複数のグループに仕分ける判定制御手段とからなるものである。

【0009】請求項5記載のメインコンデンサの充電方法は、メインコンデンサの両端子に耐電圧以下の直流高

10 電圧を直接印加し、かつこの電圧印加中にメインコンデンサの両端子間の電圧を監視することにより、任意に設定した所定電圧で直流高電圧によるメインコンデンサの充電を終了するものである。

【0010】

【作用】ストロボユニットを保持したパレットが検査位置に停止すると、ベース部が接近位置に移動する。このベース部の移動により、スイッチング用プローブ、測定用プローブ、及び給電用プローブは充電スイッチ及び電源電池の接続端子にそれぞれ接触し、また、アクチュエータ及び光センサはシンクロスイッチ及びストロボ発光部の各々の近傍に位置決めされる。そして、制御部は、

20 スイッチング用プローブ、測定用プローブ、及び給電用プローブを介してメインコンデンサに充電を行い、アクチュエータの作動によりシンクロスイッチをオンさせてストロボ発光部を発光させるとともに、光センサで受光したストロボ発光部からの光量が規定レベルに達しているか否か、また充電時間が規定時間内か否か、シンクロスイッチの接触抵抗が規定値以下か否か、ネオン管が正常か否か等を判定する。

30 【0011】図2に示すように、フィルムユニット2は、撮影機構等を備えたユニット本体3と、これを収納する外ケース4とから構成されており、この外ケース4に入れたままで写真撮影が行われる。外ケース4は、フィルムユニット2の外観を奇麗にするためのものであり、外面に印刷を施した紙箱又はプラスチックシート等が用いられる。この外ケース4には、レンズ5、ファインダー窓6、レリーズボタン7、撮影枚数表示板8、巻き上げノブ9、及びストロボ発光部10を露出させるための穴が設けられ、またストロボ撮影時には、外ケース4の切込み部11を押圧しながら撮影を行う。

【0012】図3において、ユニット本体3は、パトローネ付き写真フィルムが装填される本体部13、この本体部13の背面に被着され、本体部13との間で写真フィルムを光密に収納する後カバー14、本体部13の前に被着される前カバー15、本体部13と前カバー15との間に配置される露光ユニット16、ストロボユニット17とから構成されている。露光ユニット16には、カウンター機構、シャッター機構、フィルム巻止め機構、及びレンズ5等が内蔵され、これらは一体化されて50 いる。レンズ5は、前カバー15と露光ユニット16の

絞り開口 16 aとの間に挿装される。

【0013】本体部 13には、パトローネが装填されるパトローネ室 20と、パトローネから引き出された未露光の写真フィルムをロール状に収納するフィルム収納室 21とが設けられている。これらの底は開口となっており、後カバー 14に設けたフルトップ式の底蓋 22, 23によって塞がれる。フィルム収納室 21の底蓋 23は、写真フィルム装填の際にパトローネから未露光の写真フィルムをロール状に巻き取る治具等を挿入するためのものであり、またパトローネ室 20の底蓋 22は、撮影終了後撮影済みフィルムを収納したパトローネを取り出すときの蓋となる。

【0014】パトローネ室 20と未露光フィルム収納室 21との間には、露光開口 24が成形されており、この前面に露光ユニット 16が爪結合によって着脱自在に取り付けられる。露光ユニット 16の右横、すなわち未露光フィルム収納室 21の前面には、ストロボユニット 17が爪結合によって着脱自在に取り付けられる。

【0015】ストロボユニット 17は、図4に示すように、プリント基板 25とこれに形成されたスルーホールに半田付けされる電気部品とから構成されている。プリント基板 25には、充電開始用接点 26, 27が形成された銅箔パターン等が印刷されている。電気部品はプロテクター 28、リフレクター 29、トリガー接片 30、及び放電管 31からなるストロボ発光部 10の他に、シンクロスイッチ 33、電池 34用の電極板 35, 36、メインコンデンサ 37、ネオン管 38等からなり、これらの接続端子はプリント基板 25の外部に露呈されている。また銅箔パターンの上には、製造時期と再使用回数及びその時期とを表示するための表示部 39が設けられている。

【0016】切込み部 11の内側には、前カバー 15に一体に成形されたスイッチ部 15 aが位置する。充電開始用接点 26, 27は、スイッチ部 15 aの変位に応動して、その背面に設けた短絡板 40の接触によりONする。ネオン管 38は、メインコンデンサ 37への充電が完了した際に点滅し、前カバー 15の上面に設けた開口 15 b及び外ケース 4に設けた開口 12を通して確認することができる。また、シンクロスイッチ 33は、露光ユニット 16に設けたシャッタ羽根が絞り開口 16 aを全開する際に一方の接片 33 aを押圧し、この接片 33 aが他方の接片 33 bに接触することによりONする。

【0017】図5に示すように、ストロボユニット 17の回路 41は、充電開始用接点 26, 27がONされると、昇圧回路 42により電極板 35, 36にセットされた電源の電圧が昇圧され、この高電圧出力がトリガ用コンデンサ 44及びメインコンデンサ 37を充電するようになっている。トリガ用コンデンサ 44には、トリガ用トランジスタ 45が接続され、その一次巻線 45 aにはシンクロスイッチ 33の接片 33 aが、二次巻線 45 bには

放電管 31の放電を開始させるためのトリガ電極板 30がそれぞれ接続されている。なお、符号 38は、充電完了表示用のネオン管である。また、この図5は、検査時の接続状態を示しており、電極板 35, 36には電池 34の代わりに 1.6 V の定電圧電源 43が接続されるとともに、メインコンデンサ 37の端子 37 a, 37 bには直流高電圧供給装置 18が直接に接続されている。この直流高電圧供給装置 18については、詳しく後述する。

【0018】放電管 31は、両端子がメインコンデンサ 37の端子 37 a, 37 bに接続され、メインコンデンサ 37に蓄えられた電荷によって放電する。プロテクター 28は前面が外ケース 4から露呈されており、被写体に向けて配光する。リフレクター 29は、放電管 31から放電された光をプロテクター 28に向けて反射する。

【0019】

【実施例】工場では、現像所から回収したフィルムユニット 2を供給コンベヤに移載し、ここで、外ケース 4を取り外した後、移載装置によりフィルムユニットの分解ライン 65(図6参照)に搬送する。この分解ライン 65は、自動化となっており、インデックス回転テーブルにフィルムユニット 2を順次移載して分解してゆく。

【0020】インデックス回転テーブルには、所定間隔ごとに複数の分解パレットが固定されており、この分解パレットにフィルムユニット 2が1個ずつ一定の姿勢で保持される。保持されたフィルムユニット 2は、各ステーションで自動的に分解される。これにより、巻き上げノブ 9、前カバー 15、レンズ 5、短絡板 40、ストロボユニット 17、露光ユニット 16、電池 34、及び後カバー 14が結合している本体部 13とに分解される。

【0021】巻き上げノブ 9、前カバー 15及び本体部 13は、同じプラスチック材料であるからそのままの状態で樹脂再生工程に送られ、ペレット化される。これとは異なったプラスチック材料であるレンズ 5は、別の樹脂再生工程に送られる。また、短絡板 40は金属再生工程に送られる。さらに、露光ユニット 16は、機能検査を行った後にフィルムユニットの組立ライン 70(図6参照)に送られる。なお、電池 34は、専門の電池回収業者に引き渡される。

【0022】取り出されたストロボユニット 17は、表示部 39から製造時期と再使用回数及びその時期とが自動的に読み取られ、耐用年数を経過していないものが検査ラインに投入される。この検査ラインは、図6に示すように、無限循環方式の自動化ラインとなっており、ストロボユニット 17を各検査パレット 50に一定の姿勢で保持させた後、各検査パレット 50を複数の検査工程に循環させて、ストロボユニット 17の形状、電気特性、外観、及び動作等を検査し、この検査結果の情報を応じてストロボユニット 17を合格、準不合格、不合格

の3種類に仕分ける。

【0023】検査ラインは、ストロボユニット供給工程51、履歴データ転送工程52、エアークリーニング工程53、プロテクタークリーニング工程54、外観検査工程55、電気検査工程56、履歴マーキング工程57、合格品払出し工程58、準不合格品払出し工程59、及び不合格品払出し工程60とから構成されている。このうち電気検査工程56は、例えばラインが2本設けられ、各ラインには電気検査装置61が6台づつ設けられている。すなわち、各ラインでは6個の検査パレット50を同時に取り込んで、6個のストロボユニット17を同時に検査するから、これら2ラインを同時に稼働させると、合計で12個のストロボユニット17を同時に検査できる。各ラインには、それぞれチャンネルナンバーが付されており、オンラインでチャンネルナンバーを選択することにより希望のラインを選択して稼働させることができる。これらの電気検査工程56の前後には、分岐装置62及び合流装置63が設置されており、また分岐装置62の後、且つ合流装置63の前には複数の検査パレット50を待機させるためのストック装置64が設置されている。

【0024】検査パレット50には、図7及び図8に示すように、ストロボユニット17をこれのプロテクター28が上方に、且つメインコンデンサー37が下方に向いた姿勢で保持する2つの押さえ爪66、67が設けられている。また、この押さえ爪66、67によってストロボユニット17が保持されたとき、ストロボユニット17は、2つの位置決めピン68、69により精度良く位置決めされる。押さえ爪66、67は、軸71、72を中心に回動自在となっており、バネ73、74によりストロボユニット17を保持する方向に向けて付勢されている。供給及び払出し工程51、58、59、60には、押さえ爪66、67をバネ73、74の付勢に抗して回転させる押圧機構が設けられている。この押圧機構の作動により検査パレット50とストロボユニット17との着脱が行われる。

【0025】検査パレット50には、情報管理手段として光通信機能を備えたID(Identification)ユニット75が設けられている。このIDユニット75は、前面に配置された投光窓75a、受光窓75aを介して、検査パレット50にセットされたストロボユニット17の履歴データや検査データ等を記憶するとともに、これらのデータを制御手段としてのコンピュータ76に転送する。

【0026】図9に示すように、IDユニット75は、前記投光窓75a、受光窓75aを介してコンピュータ76等とデータの送受信を行う赤外線投受光部77、通信I/F78、CPU79、メモリ80からなる。このメモリ80は検査項目毎にアドレスが決めてあり、このアドレスに検査結果が寸法、面積等のデータで書き込ま

れる。また、このアドレスには検査済みか否かのデータも書き込まれる。また、各検査機、コンピュータ76、及び後述する集積部等には、IDユニット75とデータの送受信を行うIDユニット81が接続されている。このIDユニット81は、赤外線投受光部82、通信I/F83、CPU84、入出力I/F(RS232C、デジタルI/O)85から構成される。

【0027】電気検査装置61は、図1に示すように、遮光カバー86、スイッチング用及び給電用に用いられる8本のプローブ、ネオン管発光検知部(図示なし)、制御部88、アクチュエータ89、ストロボ光測定部90、定電圧電源43、及び直流高電圧供給装置18から構成されており、プローブ87、ネオン管発光検知部、アクチュエータ89は遮光カバー86の内部に固定されている。遮光カバー86は、ストロボ発光量を測定するときに、他のストロボユニット17から発光されるストロボ光が浸入しないようにするためにものである。この遮光カバー86は、検査パレット50の在席を検知すると、図示していないシリンドー等の移動機構によって検査パレット50から退避した退避位置と検査パレット50に近寄った接近位置との間で移動する。この移動は、検査パレット50の搬送方向に対して直交する方向となる。

【0028】プローブ87の各々は、後端がケーブルを介して直流高電圧供給装置18、定電圧電源43、及び制御部88に接続されており、また遮光カバー86が接近位置のときに先端がプリント基板25の上の所定の接点に接触する。プローブ87が接触する端子は、メインコンデンサ37の端子37a、37b、シンクロスイッチ33の両電極、充電開始用接点26、27、及び電池用(+、-)電極35、36である。

【0029】直流高電圧供給装置18は、図5に示すように、給電用のプローブ87を介してメインコンデンサ37の端子37a、37bに直接にメインコンデンサ37の耐電圧以下、例えばDC350Vの直流高電圧を印加するもので、直流高電圧電源19、スイッチ32、電流制限用の抵抗46、逆流防止用のダイオード47、電圧検出部48、及びスイッチ駆動部49からなる。電圧検出部48はプローブ87を介してメインコンデンサ37の端子電圧を常時測定しており、これが設定した所定の電圧、例えば270Vになったときに、スイッチ駆動部49を介してスイッチ32をOFFにし、メインコンデンサ37の端子37a、37bに対する直流高電圧充電を停止する(図10の実線参照)。

【0030】抵抗46の抵抗値は、充電時間及び、直流高電圧電源19の電源電圧と直流高電圧供給装置18の回路構成とストロボユニット17の回路41の電流容量から決定される。例えば、前記直流高電圧の電圧を300V、前記電流容量を1A、メインコンデンサ37の静電容量を100μF、充電完了電圧を270Vとする

と、電流制限抵抗の値は 300Ω かつ充電時間は抵抗とメインコンデンサの回路の過渡現象により約 6.9 ms となる。そして、メインコンデンサ 37 の端子電圧が 270 V になった後、直流高電圧の印加を終了して 1.6 V の定電圧電源 43 のみによって充電を継続すると、メインコンデンサ 37 の端子電圧が 300 V になるまで約 2 秒かかる。したがって、メインコンデンサ 37 の端子電圧が 0 V から 300 V に達するまで約 2.069 秒で充電でき、 1.6 V の定電圧電源 43 のみによる充電時間が約 7.5 秒かかる（図 10 の破線参照）のに比べて充電時間の大幅な短縮が達成できる。

【0031】ネオン管発光検知部は、例えば受光センサ等が用いられ、遮光カバー 86 が接近位置のときにネオン管 38 の近傍に位置決めされ、受光センサでネオン管 38 の発光を検出すると、これに応じた検知信号を制御部 88 に送る。ストロボ光測定部 90 は、遮光カバー 86 に設けた開口 86a の上に固定されており、開口 86a、拡散板 91、及び ND フィルター 92 を通って入射したストロボ光をフォト・ダイオード 93 で受光し、フォト・ダイオード 93 で得られた信号を制御部 88 に送る。

【0032】アクチュエータ 89 は、図 11 に示すように、ソレノイド 95、連結板 96、バネ 97、固定ガイド棒 98、及び叩き棒 99 とから構成されており、遮光カバー 86 が接近位置のときにシンクロスイッチ 33 の近傍に位置決めされる。ソレノイド 95 は、制御部 88 の制御により駆動される。このソレノイド 95 が ON すると、プランジャー 95a に連結された連結板 96 が軸 101 を中心として反時計方向に回転する。叩き棒 99 は、固定ガイド棒 98 にしたがってシンクロスイッチ 33 の接片 33a を叩く叩き位置とこれから退避する退避位置との間で移動自在となっており、バネ 97 により退避位置へ向けて付勢されている。そして、叩き棒 99 は、連結板 96 の反時計方向への回転により叩き位置に向けて移動しシンクロスイッチ 33 を ON する。

【0033】制御部 88 は、各プローブ 87 を通して各接点間の抵抗、リーク、電圧や電流等の測定やアクチュエータ 89 の制御等を、予め定められたシーケンスに基づいて実行する。そして、各検査項目毎に得られた測定データを階級化処理し、所定の閾値により合格、準不合格、不合格の判定を行った後、この各測定データ及び各判定データを ID ユニット 81 を介して検査パレット 50 の ID ユニット 75 に転送すると同時に、コンピュータ 76 に伝送する。なお、検査の迅速化のため、1 項目でも不合格の判定が出たストロボユニット 17 は、その時点で以降の全ての検査は中止される。また、合格及び準不合格の判定の場合には、検査は継続され、その都度検査データは ID ユニット 75 に記憶されるとともにコンピュータ 76 に伝送される。

【0034】電気検査装置 61 だけでなく、他の検査機

も ID ユニット 75 への転送前に、各測定データに対して下記の式による階級化処理を施す。この階級化処理を簡単に説明する。

【0035】

$$[\text{式 1}] L_n = \text{INT}(A_n \times X_n + B_n)$$

L_n : 階級値

A_n : ゲイン値

X_n : 測定値の生データ

B_n : バイアス値

INT : 実数の整数化処理（少數部の切捨て・切上げ・四捨五入等）

【0036】ゲイン値 A_n は、主に面積データを扱う場合に用いられ、通常は「1」より大きな値であるが、本実施例のように寸法データのみを扱う場合には主に「1」とする。また、バイアス値 B_n は、主に寸法データを扱う場合に用いられ、本実施例では例えば 20 とする。例えば、測定値の生データが 3.456 mm のときには、INT を四捨五入すると、階級値 L_n は式 1 により次のようになる。

$$L_n = \text{INT}(1 \times 3.456 + 20)$$

$$= \text{INT}(23.456)$$

$$= 23$$

この階級化処理によって、転送する各測定データが圧縮され、転送時間が短縮されるとともに、閾値による測定データの判定が容易になる。

【0037】次に、ストロボユニット 17 の検査ラインの作用を説明する。ストロボユニット供給工程 51 では、フィルムユニット分解ライン 65 から供給されたストロボユニット 17 を各検査パレット 50 に保持せるとともに、ID ユニット 75 の全データをリセットする。このリセットに際しては、そのままで判定されたときには判定結果が必ず不合格となるデータ、例えば“F”を書き込む。これは、通信異常や作業ミスによって測定データや判定データが ID ユニット 75 に書き込まれなかつたときに、データ不明のものを間違って合格品として集積されることを防止するためのものである。また、搬送先のデータ・検査条件のデータでも“F”を使用しないようにすることによりデータ異常が検出できるので、例えば再度検査を実行させたり、途中排出せたりという処理を行うことができる。

【0038】履歴データ転送工程 52 では、まず表示部 39 からマーキングされている生産年月日、生産工場、製品タイプ、使用回数、リユース許可年月日が読み取られ、これらのデータとともに、検査条件、集荷地区、分解装置等の工程経路の実績等のデータが履歴データとして ID ユニット 75 に転送される。この表示部 39 の読み取りは、例えば履歴データ転送工程 52 に設けられた専用のコンピュータに接続された読み取りセンサによって行われ、この履歴データは ID ユニット 81 を介して ID ユニット 75 に転送される。

【0039】エアークリーニング工程53では、ストロボユニット17に向けてエアーを吹き付け、ストロボユニット17に付着したゴミを吹き飛ばす。プロテクタークリーニング工程54は、帯状のクリーニングテープが巻き付けられたクリーニングヘッドと、洗净液を上方からプロテクター28に向けて噴射する洗净液噴射装置とが設けられており、洗净液噴射装置から洗净液が噴射された後に、検査パレット50がクリーニングヘッドの下部まで移動した後に、クリーニングヘッドがプロテクター28の表面を押圧する位置まで移動し、クリーニングテープを左右方向に数回往復運動してプロテクター28の表面をクリーニングする。

【0040】外観検査工程55は、各電気部品の姿勢検査、プロテクター28の表面の傷、及び汚れ等の検査、リフレクター29の内面汚れ検査、シンクロスイッチ33の曲がり検査、ネオン管38及びメインコンデンサ37の曲がり検査、及び電池用接片35、36の曲がり検査を行う。そして、これらの測定データ及び判定データは、各検査機からIDユニット75に転送されるとともに、IDユニット81を介してオンラインでコンピュータ76に伝送される。

【0041】外観検査を通過したストロボユニット17は、分岐装置62を通ってストック装置64で検査パレット50が6個たまつた時点で電気検査装置61に6個同時に搬送される。搬送された検査パレット50は、位置決めスッパーで位置決めされ検査位置で停止する。停止した検査パレット50は、光電センサで在席が検知される。この在席検知後に、遮光カバー86が下降して接近位置の状態となる。このとき各プローブ87、アクチュエータ89、及びネオン管発光検知部が各々の近傍に位置決めされる。

【0042】電気検査装置61による電気特性の測定は、図12に示すシーケンスに従って行われる。先ず、メインコンデンサ37の放電を行う。この放電中には、メインコンデンサ37の電圧を測定しており、この電圧が、例えば2V以下となったら、この時点から100ms後に終了とする。放電開始後から所定時間経過後にメインコンデンサ37の電圧が2V以下にならない場合には、不合格であるからこの判定データをIDユニット75に転送するとともに、コンピュータ76に伝送した後、以降の検査を中止する。

【0043】合格したストロボユニット17に対して、アクチュエータ89を駆動させ、シンクロスイッチ33の接触抵抗を測定する。測定は10ms毎に50回迄行う。判定は測定値が、例えば2Ω以上であつたら不合格とする。50回とも不合格の場合には、アクチュエータ89の駆動を停止し、再度やり直す。やり直し回数は、設定値に応じて変更し、1回でも不合格がなければ次の検査に進む。

【0044】次に、電池用接片35、36の端子間のリ

ーク電流を測定する。試験電圧は1.6Vで行い、判定は、例えば1μA以上をNGとする。次に、図10の実線で示すように、所定時間、例えば500msだけ1.6Vで充電を行い、この時のメインコンデンサ37の電圧を測定する。この測定値が30V以下を不合格とする。続いて、直流高電圧供給装置18のスイッチ32をONにしてメインコンデンサ37の端子37a、37bに直接に350Vの直流高電圧を印加し、高速充電を行う。そして、ネオン管38の発光した時のメインコンデンサ37の電圧を測定する。

【0045】この後、メインコンデンサ37の端子電圧が所定の設定電圧、例えば270Vに達すると、これが電圧検出部48によって検出され、スイッチ駆動部49によってスイッチ32がOFFにされる。これによつて、直流高電圧供給装置18による直流高電圧の印加が停止され、1.6Vの定電圧電源43のみによる充電が継続される。そして、この1.6Vでの充電中にネオン管38の点滅が持続されるかを検査する。時間は発光検知より、例えば2s間行う。次に、放電を100ms行い、このときのメインコンデンサ37の電圧が、例えば230V以上であれば不合格とする。そして、またスイッチ32をONにして高速充電を行い、充電開始からメインコンデンサ37の電圧が規定電圧、例えば220Vに達した時点までの時間を測定する。判定は、例えば8s以上であれば不合格とする。

【0046】その後、10msだけアクチュエータ89を駆動させ、シンクロスイッチ33をONする。このとき、制御部88は、ストロボ光測定部90から得られる信号を監視し、光量が規定レベルに達しているか否かを判定する。更に、ストロボ発光後のメインコンデンサ37の電圧を測定し、この電圧が、例えば70V以上であれば不合格とする。その後、定電圧電源43のみによる充電を開始し、規定時間内にネオン管38が発光するかを検査する。判定は、ネオン管発光検知部から得られる信号が、例えば8s以上である場合には不合格とする。そして、ネオン管38が発光した時点のメインコンデンサ37の電圧を測定する。判定は、例えば280～310V以外の場合には不合格とする。更に、そのまま充電を継続し、充電を開始してから規定時間、例えば10s以内でメインコンデンサ37の電圧が規定電圧、例えば310Vに達するか否かを判定する。また、この間でネオン管38の点滅回数を計数する。この判定は、例えば1秒間に17カウント以上を不合格とする。

【0047】次に、アクチュエータ84を駆動させ、シンクロスイッチ33をONする。これによりストロボ発光が行われ、発光後のメインコンデンサ37の電圧が規定電圧、例えば70V以上であれば不合格とする。最後にメインコンデンサ37の放電を規定時間、例えば2sを行い、放電後のメインコンデンサ37の電圧が規定電圧、例えば5V以上であれば不合格とする。なお、電気

検査中にメインコンデンサ37の電圧が、例えば350Vを越えると、ただちに不合格と判定し、検査を中止する。

【0048】電気検査工程56での測定データ及び判定データは、各検査パレット50のIDユニット75に記憶されるとともに、コンピュータ76に伝送される。そして、コンピュータ76に接続されたCRTの画面に表示されているメニュー項目から、「不良発生項目別累計」もしくは「測定データ」を選択すると、図13及び図14に示すように、「不良発生項目別累計」や「測定データ」がCRT画面にオンライン表示される。「不良発生項目別累計」は、検査ステップ毎に発生した不良品の数を生産管理時間又は作業者のリセット操作時から累計するもので、各時点の不良発生率も分かるようになっている。なお、図13及び図14において、チャンネルが8個あるのは、電気検査工程56が8ライン迄対応できるように構成されていることを示している。そして、図13及び図14に示されているCRT画面の表示でチャンネル3, 5がNGで他がOKとなっているのは、直前の検査においてチャンネル3, 5はNGであり、チャンネル1, 2, 4, 6, 7, 8はOKであることを示している。

【0049】コンピュータ76に伝送された各判定データは、各ストロボユニット17毎に集積され、全検査項目の判定データが揃った時点で各ストロボユニット17が総合判定される。この結果、各ストロボユニット17は、例えば「合格品」、「準不合格品」、「不合格品」の3種類に分けられる。「合格品」は全検査項目の判定データが合格で、そのまま再使用可能なものである。

「準不合格品」は1項目でも準不合格の判定データを含むもので、修理すれば再使用可能なものである。「不合格品」は前述したように1項目でも不合格の判定が出て以降の全検査が中止されたもので、再使用が不可能であるから、集積後廃棄される。

【0050】また、全検査項目の測定データ及び判定データが揃うと、オフラインでの測定データ一覧及び度数分布グラフの表示を行うことができる。測定データ一覧は、例えば、シンクロスイッチの接触抵抗値、リーク電流値、ストロボ発光の光量、充電時間(4点)、ネオン管の発光電圧、ネオン管の点滅回数、充電電圧の計10項目の測定データを測定の時系列に一覧表示したり、例えば、図15に示すように、各検査ステップでの判定結果を時系列に一覧表示するものである。

【0051】測定データの度数分布グラフは、例えば、シンクロスイッチの接触抵抗値、リーク電流値、ストロボ発光の光量、充電時間(4点)、ネオン管の発光電圧、ネオン管の点滅回数、充電電圧の計10項目について、メーカー、ロット毎に収集した測定データをそれぞれ度数分布グラフに表示し、市場評価等の解析に利用するものである。例えば、図16に示すグラフは、シンク

ロスイッチの接触抵抗値についての度数分布グラフをCRT画面に表示したものである。

【0052】電気検査工程56を通過したストロボユニット17は、ストック装置64に送られ、合流装置63を通じて履歴マーキング工程57に向けて搬送される。この履歴マーキング工程57では、「合格品」のストロボユニット17の表示部39にマーキングを施し、再使用回数の履歴を記録する。そして、コンピュータ76からIDユニット81を介して、各検査パレット50のIDユニット75に総合判定データが転送される。履歴マーキング工程57を経たストロボユニット17は、合格品出し工程58に搬送される。

【0053】合格品出し工程58では、検査パレット50のIDユニット72から総合判定データを読み取ることにより、合格品のストロボユニット17のみが払い出される。払い出されたストロボユニット17は、合格品集積部121に所定量となるまで集積され、その後ファイルムユニット2の組立ライン47にそのまま供給される。

【0054】合格品出し工程58を経て残ったストロボユニット17は、準不合格品出し工程59に搬送される。ここでは、準不合格品のストロボユニット17のみが払い出され、準不合格品集積部122に搬送される。そして、ストロボユニット17は検査パレット50からトレイに移される。このトレイの各々にもIDユニット75が設置されており、検査パレット50のIDユニット75に記憶されていた全てのデータが各トレイのIDユニット75に転送される。

【0055】準不合格品集積部122のトレイに集積されたストロボユニット17は、IDユニット75のデータに従って不具合のある部品毎に仕分けされ、自動詰め替え機によって再集積部123に再集積される。このときの仕分け方法としては、例えば各検査項目毎の仕分けも可能であるが、この場合には例えば8000項目以上となって実際的でない。そこで、同一部品毎に仕分けると、例えば5~20項目となって適度な項目数となるとともに、部品毎であるから修理の実施に際して都合がよい。そして、再集積部123に再集積されたストロボユニット17は、修理工程124に送られ、不良部品の手直しが行われる。手直しされたストロボユニット17は、ストロボユニット供給工程51に戻され、再検査された後、合格品と判定された場合には、合格品出し工程58、合格品集積部121を経てファイルムユニットの組立ライン70に供給される。

【0056】準不合格品出し工程59を経て更に残ったストロボユニット17は、不合格品出し工程60に搬送される。ここで、不合格品のストロボユニット17が払い出され、不合格品集積部125に所定量になるまで集積された後、廃棄される。

【0057】なお、IDユニット75の代わりに、図1

7に示すような不良表示部130を設けてもよい。この不良表示部130には、4つの突出片130a～130dが出入り自在に設けられている。これらの4つの突出片130a～130dの突出長さを電気的に読み取ることにより、派出工程58～60での仕分けが自動的に行えるとともに、不合格品の不良内容を4種類まで識別できる。

【0058】以上説明した実施例では、各検査項目毎の判定は各検査機で行い、この判定データをオンラインでコンピュータに伝送するようにしたが、個々の測定データはIDユニットに記憶しておき、全ての検査が終了した後、コンピュータがIDユニットから全検査項目の測定データを読み出して各検査項目毎の判定及び総合判定を行うようにしてもよい。この場合には、判定の閾値も1ヶ所で管理することができる。

【0059】また、前記再集積の作業は、自動詰め替え機によって行ったが、人手によって行ってもよい。また、不具合の発生頻度が少ない部品は、複数の部品を同一のトレイに集積するのがよい。また、上記実施例では、各トレイ毎にIDユニットを設置したが、例えばトレイに識別番号を付け、各トレイの集積位置に対応して不具合部品データとトレイの識別番号を印字した紙を修理品のストロボユニットの各々に添付してもよい。また、修理品のストロボユニットは、修理部門毎に1つのトレイに集積するようにしてもよい。

【0060】また、IDユニットに、例えばLEDや液晶表示板等の表示手段を設け、目視によって総合判定等のデータを確認できるようにしてもよい。また、修理の方法は、検査ライン内で行っても、外部で行ってもよく、また治具等を用いて復元するものと、新しい部品と交換するものがある。また、IDユニットの通信機能として、光通信を採用したが、この他に、マイクロ波通信、磁気通信等を用いることができ、通信距離、コスト等の点から使い分けることができる。なお、本発明は、リサイクル品だけでなく、新規作成のストロボユニットの検査にも用いることができる。

【0061】

【発明の効果】以上詳細に説明したように、本発明の検査装置によれば、ストロボユニットを一定の姿勢で保持し、検査位置に移動してきたときに停止されるパレットを用いたから、位置決めが容易になる。しかも、スイッチング用プローブ、測定用プローブ、及び給電用プローブとアクチュエータ及び光センサとをベース部に設け、このベース部を検査位置で停止したパレットが保持するストロボユニットに向かって接近した接近位置と離れた退避位置との間で可動とし、ベース部が接近位置に移動することによってスイッチング用プローブ、測定用プローブ、及び給電用プローブが充電スイッチ、メインコンデンサ、シンクロスイッチ、及び電源電池の接続端子にそれぞれ接触し、またアクチュエータ及び光センサがシ

ンクロスイッチ及びストロボ発光部の各々の近傍に位置決めされるから、短時間で効率良くコネクト作業が行える。

【0062】そして、制御部が、前記スイッチング用プローブ、測定用プローブ、及び給電用プローブによりメインコンデンサに充電を行い、前記アクチュエータを制御してシンクロスイッチをオンさせることによりストロボ発光部を発光させ、前記光センサで受光したストロボ発光部からの光量が規定レベルに達しているか否か、また、別の発明に記載したように充電時間が規定時間内か否か、シンクロスイッチの接触抵抗が規定値以下か否か、リーク電流が規定値以下か否か、及びネオン管が正常か否か等を判定するから、ストロボユニットを安定した品質で再使用することができる。

【0063】また、本発明の検査システムによれば、検査パレットに情報管理手段を設け、これに各種のデータを記憶させるとともに、判定制御手段が検査項目毎の判定データに基づいて総合判定、仕分けを行うようにしたので、各種データを一括管理できるとともに、オンラインで各測定データを表示したり、オフラインで度数分布グラフを作成してストロボユニットの市場評価を行う等、データの有効活用を容易に達成できる。また、本発明の充電方法によれば、メインコンデンサの両端子に耐電圧以下の直流高電圧を直接印加するとともにメインコンデンサの両端子間の電圧を監視して任意設定の電圧で印加を停止するようにしたので、充電時間が短縮でき、ストロボユニットの電気特性の検査を高速化できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】ストロボユニットの検査装置の概略を示す説明図である。

【図2】レンズ付きフィルムユニットの外観を示す斜視図である。

【図3】ユニット本体の分解斜視図である。

【図4】ストロボユニットの分解斜視図である。

【図5】ストロボユニット及び直流高電圧供給装置の回路図である。

【図6】ストロボユニットの検査ラインの概略を示す説明図である。

【図7】検査パレットを示す斜視図である。

【図8】検査パレットにストロボユニットを固定した状態の背面図である。

【図9】IDユニットの構造を概略的に示す説明図である。

【図10】メインコンデンサの端子電圧の変移を示すグラフである。

【図11】アクチュエータの概略を示す斜視図である。

【図12】電気検査装置のシーケンスを示すフローチャートである。

【図13】不良発生項目別累計表の表示例を示す説明図である。

17

【図14】オンラインでの測定データの表示例を示す説明図である。

【図15】オフラインでの測定データ一覧表の表示例を示す説明図である。

【図16】測定データ度数分布グラフの表示例を示す説明図である。

【図17】不良表示部を示す説明図である。

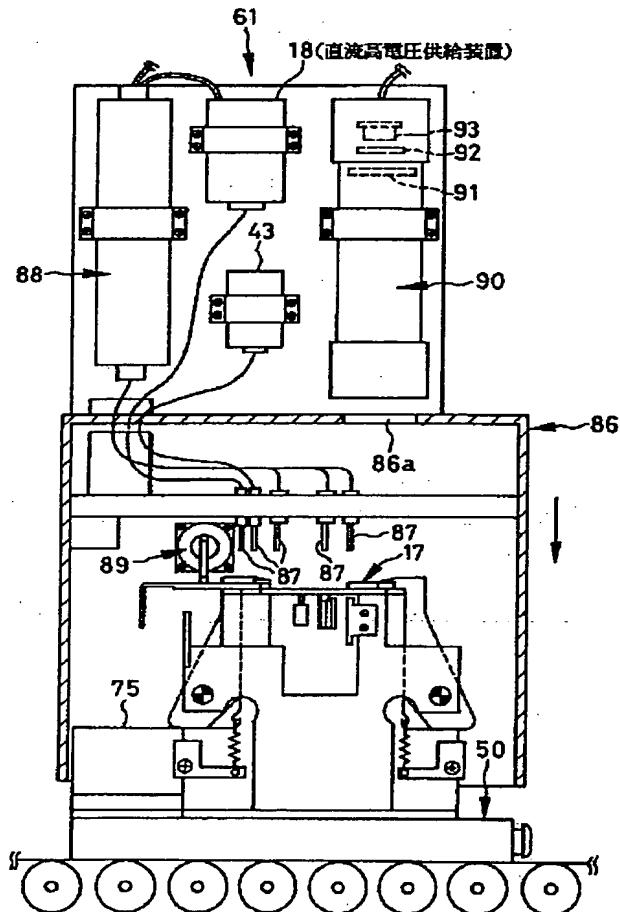
【符号の説明】

- 2 レンズ付きフィルムユニット
- 17 ストロボユニット
- 18 直流高電圧供給装置
- 43 定電圧電源
- 50 検査パレット
- 51 ストロボユニット供給工程
- 52 履歴データ転送工程
- 55 外観検査工程
- 56 電気検査工程
- 57 データ転送・履歴マーキング
- 58 合格品払出し工程

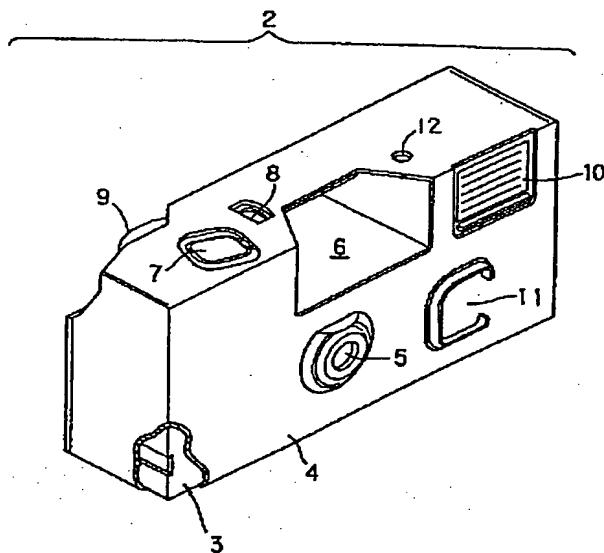
18

- 59 準不合格品払出し工程
- 60 不合格品払出し工程
- 61 電気検査装置
- 62 分岐装置
- 63 合流装置
- 64 ストック装置
- 75, 81 IDユニット
- 76 コンピュータ
- 86 遮光カバー
- 87 プローブ
- 88 制御部
- 89 アクチュエータ
- 90 ストロボ光測定部
- 121 合格品集積部
- 122 準不合格品集積部
- 123 再集積部
- 125 不合格品集積部
- 130 不良表示部

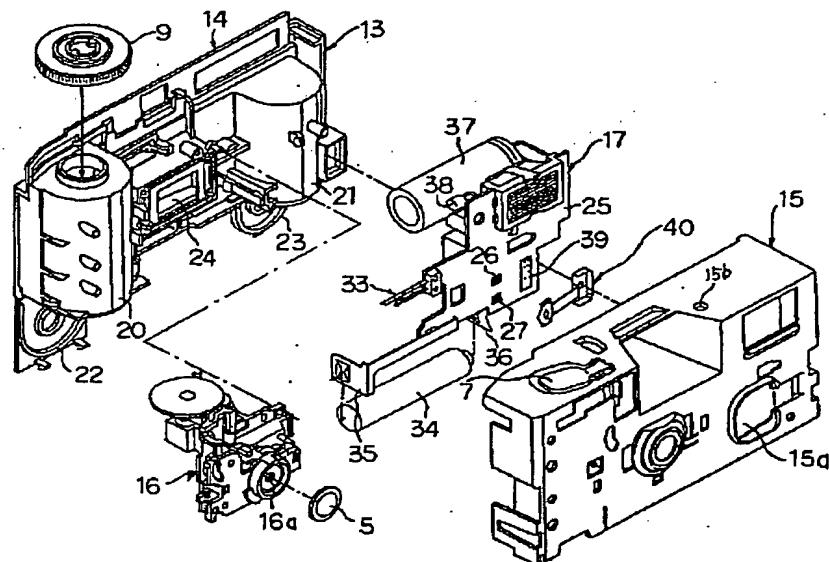
【図1】



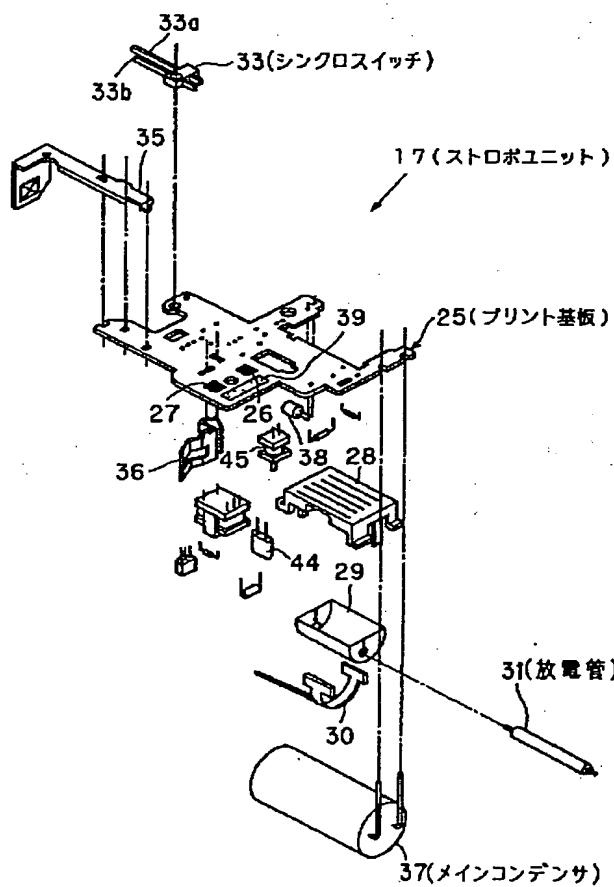
【図2】



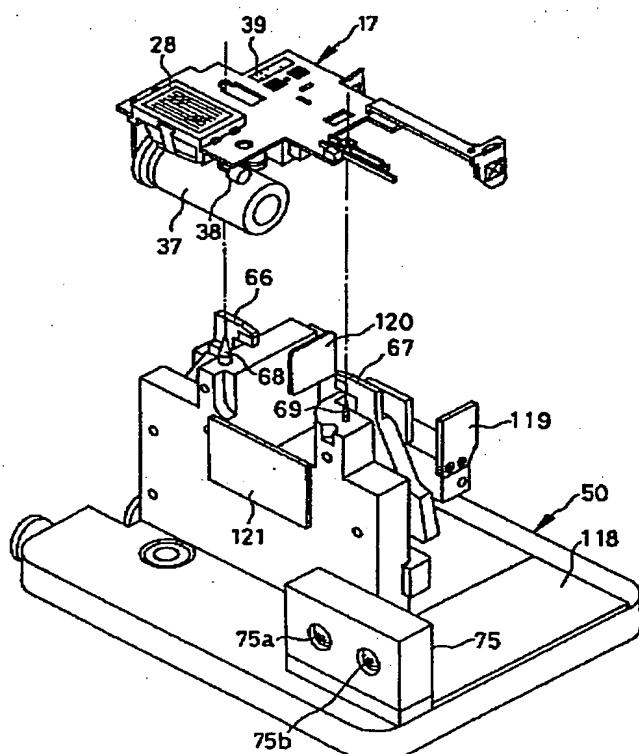
【図3】



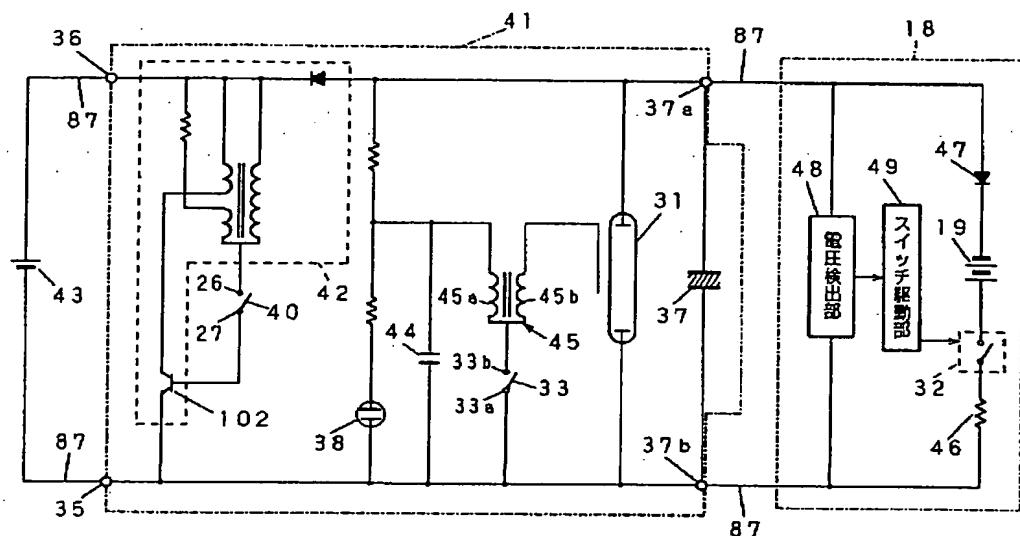
【図4】



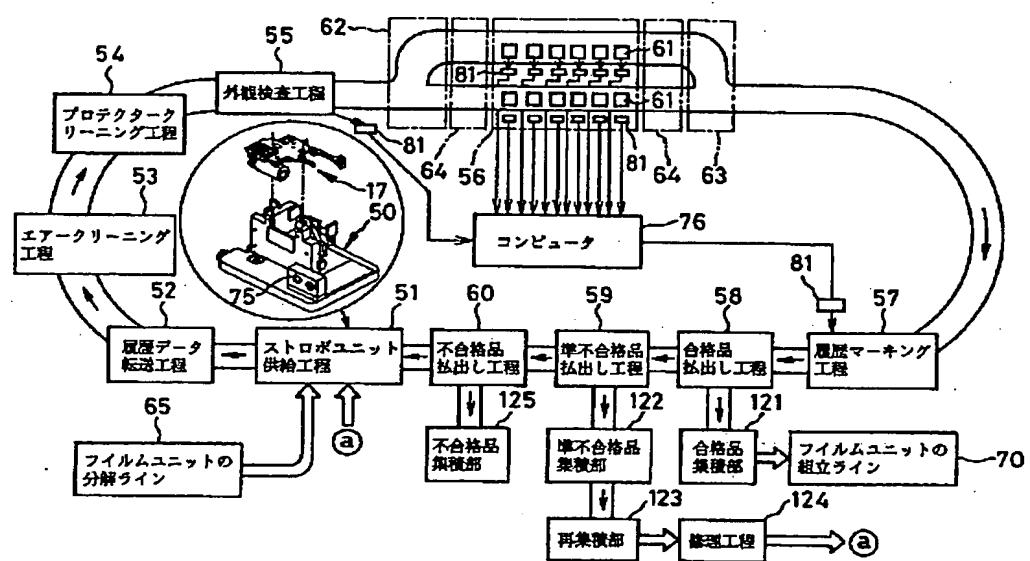
【図7】



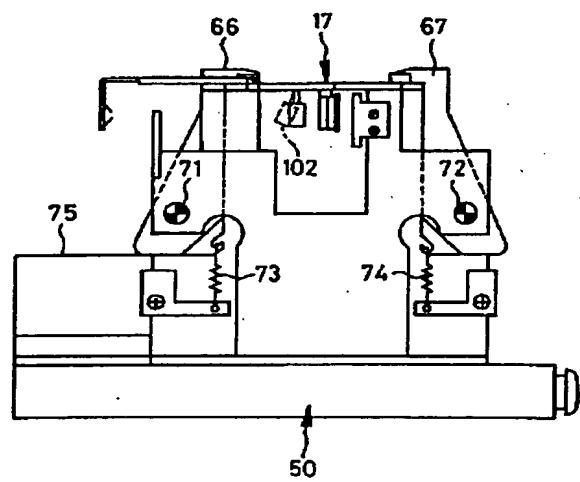
【図5】



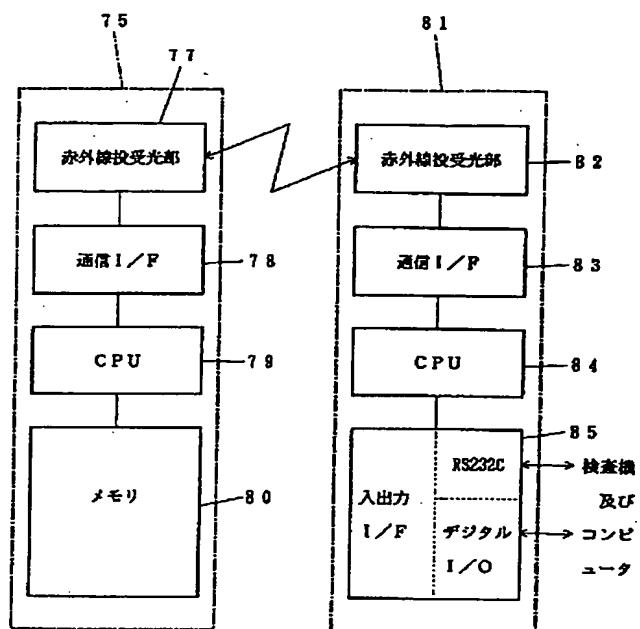
【図6】



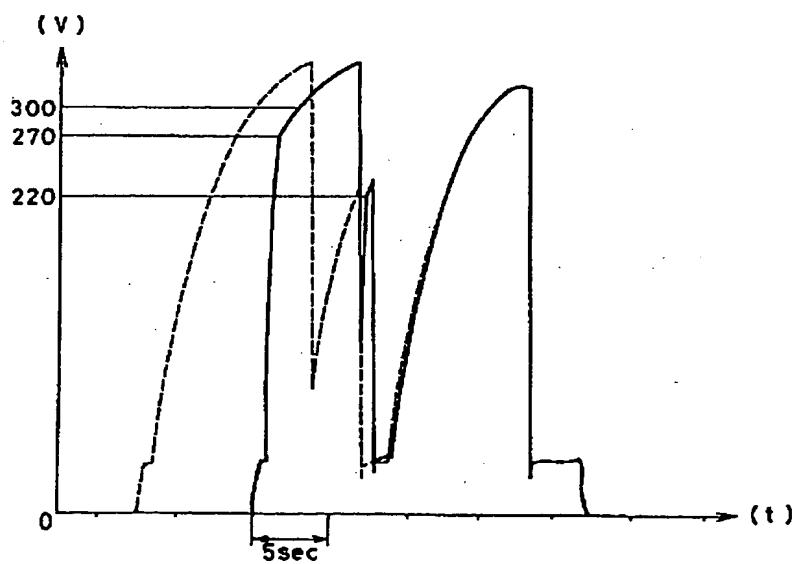
【図8】



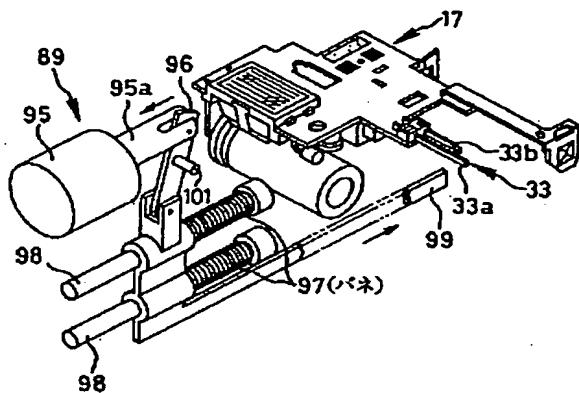
【図9】



【図10】



【図11】

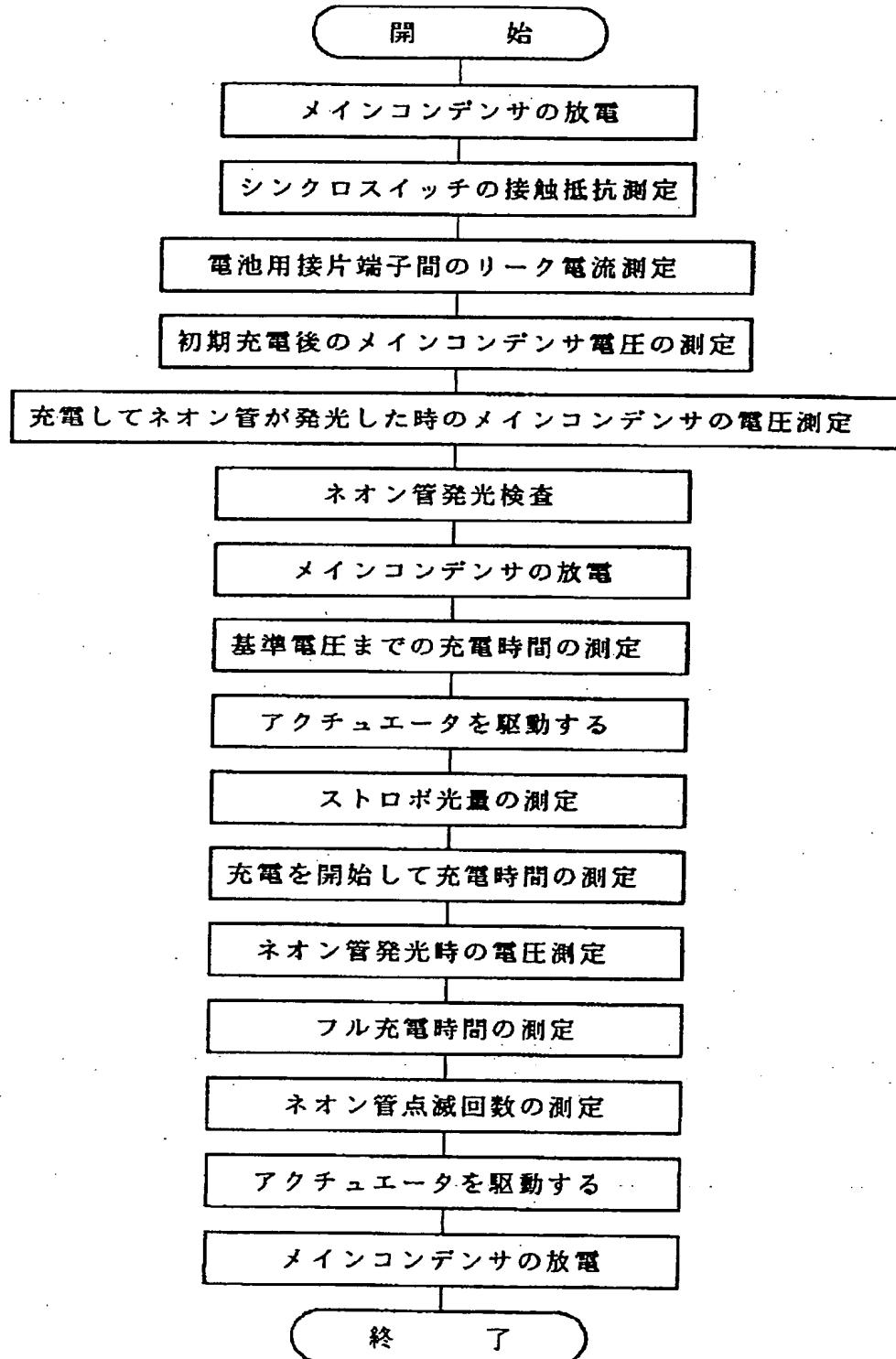


【図13】

S T E P	*** 不良発生項目別累計 ***							
	1	2	3	4	5	6	7	8
OK	OK	OK	NG	OK	NG	OK	OK	OK
NG	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
2	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
3	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
4	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
5	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
8	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
10	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
11	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
12	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
13	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
14	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
(シングルスイッチ接触抵抗 0)								
(リード電流)								
(初期充電電圧)								
(充電時間 1)								
(急速充電時間)								
(発光光量)								
(充電時間 2)								
(ネオン管点灯電圧)								
(フル充電時間)								
(ネオン管点滅回数)								

設定 全体 ON 連転 ML 連転 ファイル メニュー 次頁

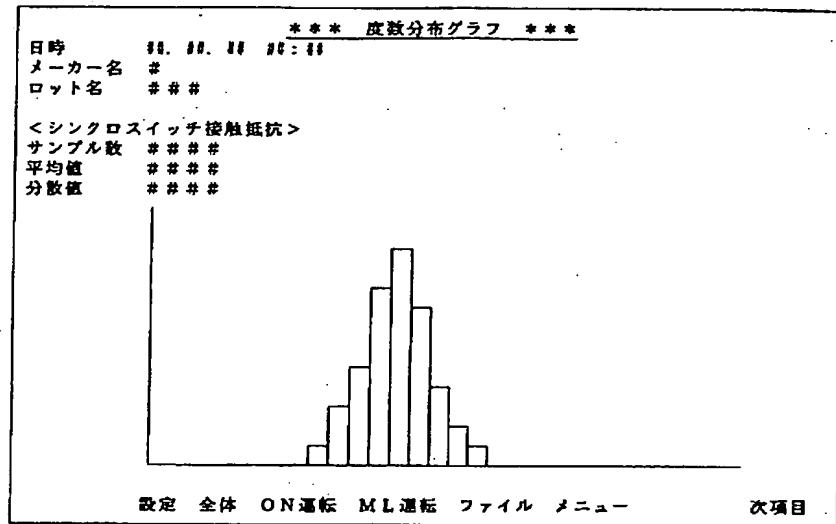
【図12】



【図14】

【図15】

【図16】



【図17】

